

---

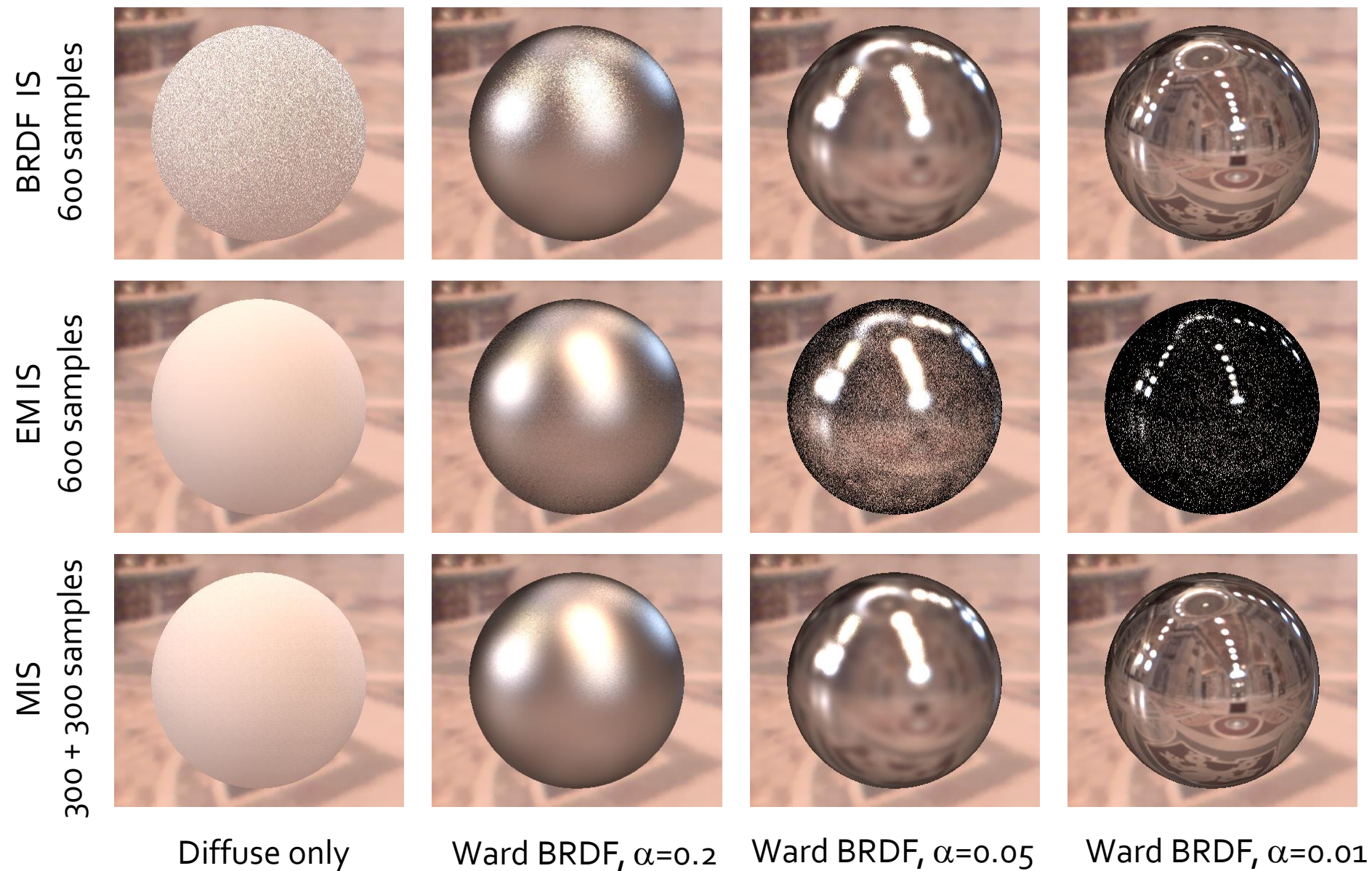
# Počítačová grafika III – Multiple Importance Sampling

---

Jaroslav Křivánek, MFF UK

[Jaroslav.Krivanek@mff.cuni.cz](mailto:Jaroslav.Krivanek@mff.cuni.cz)

# Sampling strategies



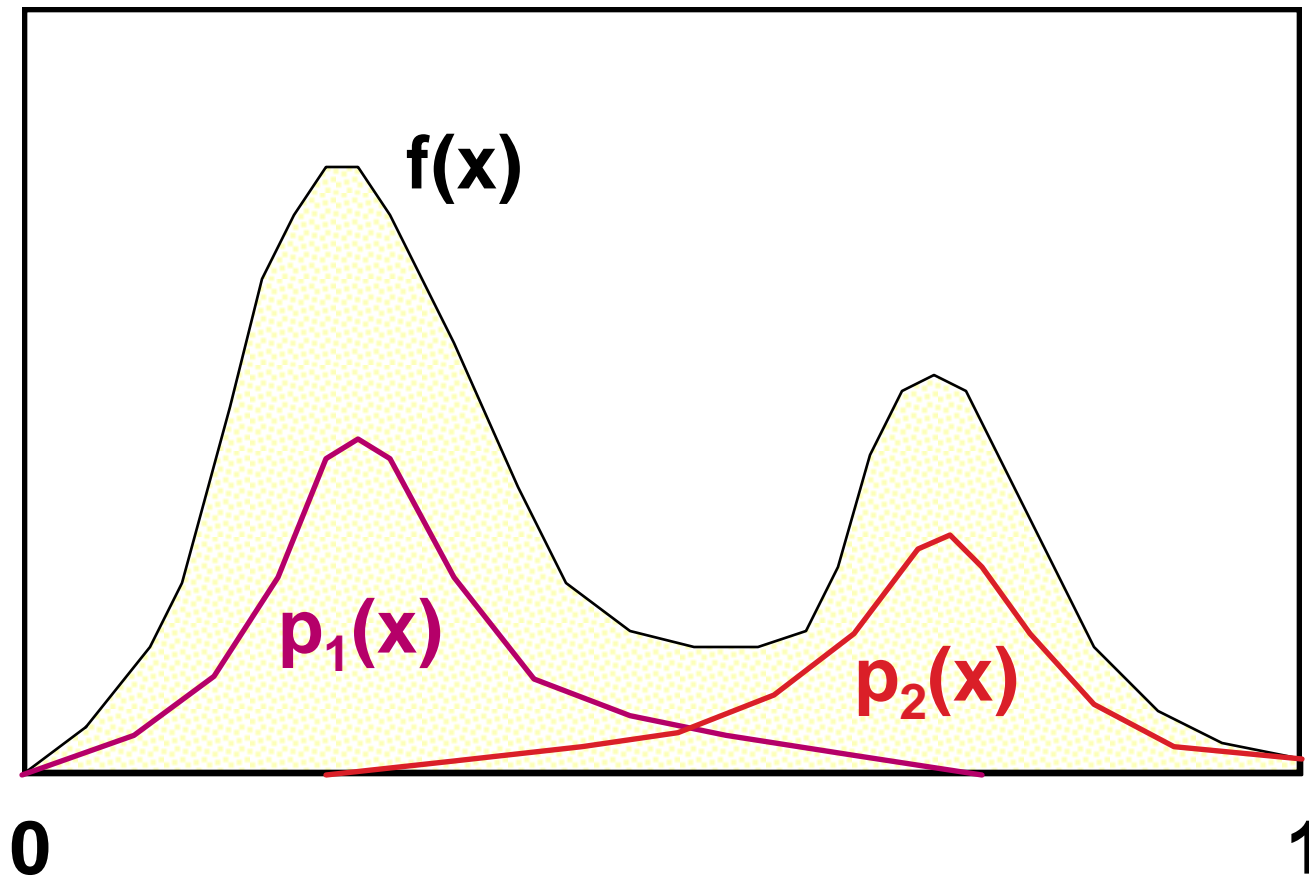
---

# **Zpět k obecnému MC integrování – „Multiple Importance Sampling“**

---

# Multiple Importance Sampling

(Veach & Guibas, 95)



# Multiple importance sampling

- Máme dáno  $n$  vzorkovacích „technik“ (hustot pravděpodobnosti)  $p_1(x), \dots, p_n(x)$
- Z každé techniky (hustoty) vybereme  $n_i$  vzorků  $X_{i,1}, \dots, X_{i,n_i}$
- **Kombinovaný estimátor**  
kombinační váhy  
(mohou být různé pro každý vzorek)

$$F = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} w_i(X_{i,j}) \frac{f(X_{i,j})}{p_i(X_{i,j})}$$

vzorkovací  
techniky

vzorky z  
jednotlivých technik

# Nestrannost kombinovaného odhadu

$$E[F] = \dots = \int \left[ \sum_{i=1}^n w_i(x) \right] f(x) dx \equiv \int f(x)$$

- Podmínka pro váhové funkce

$$\forall x: \sum_{i=1}^n w_i(x) = 1$$

# Volba váhových funkcí

- **Cíl:** minimalizovat rozptyl kombinovaného estimátoru

1. Aritmetický průměr (velmi špatná kombinace)

$$w_i(x) = \frac{1}{n}$$

2. Vyrovnaná heuristika (velmi dobrá kombinace)

□ ....

# Vyrovnaná heuristika (Balance heurist.)

- Kombinační váhy

$$\hat{w}_i(\mathbf{x}) = \frac{n_i p_i(\mathbf{x})}{\sum_k n_k p_k(\mathbf{x})}$$

- Výsledný estimátor (po dosazení vah)

$$F = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n_i} \frac{f(X_{i,j})}{\sum_k n_k p_k(X_{i,j})}$$

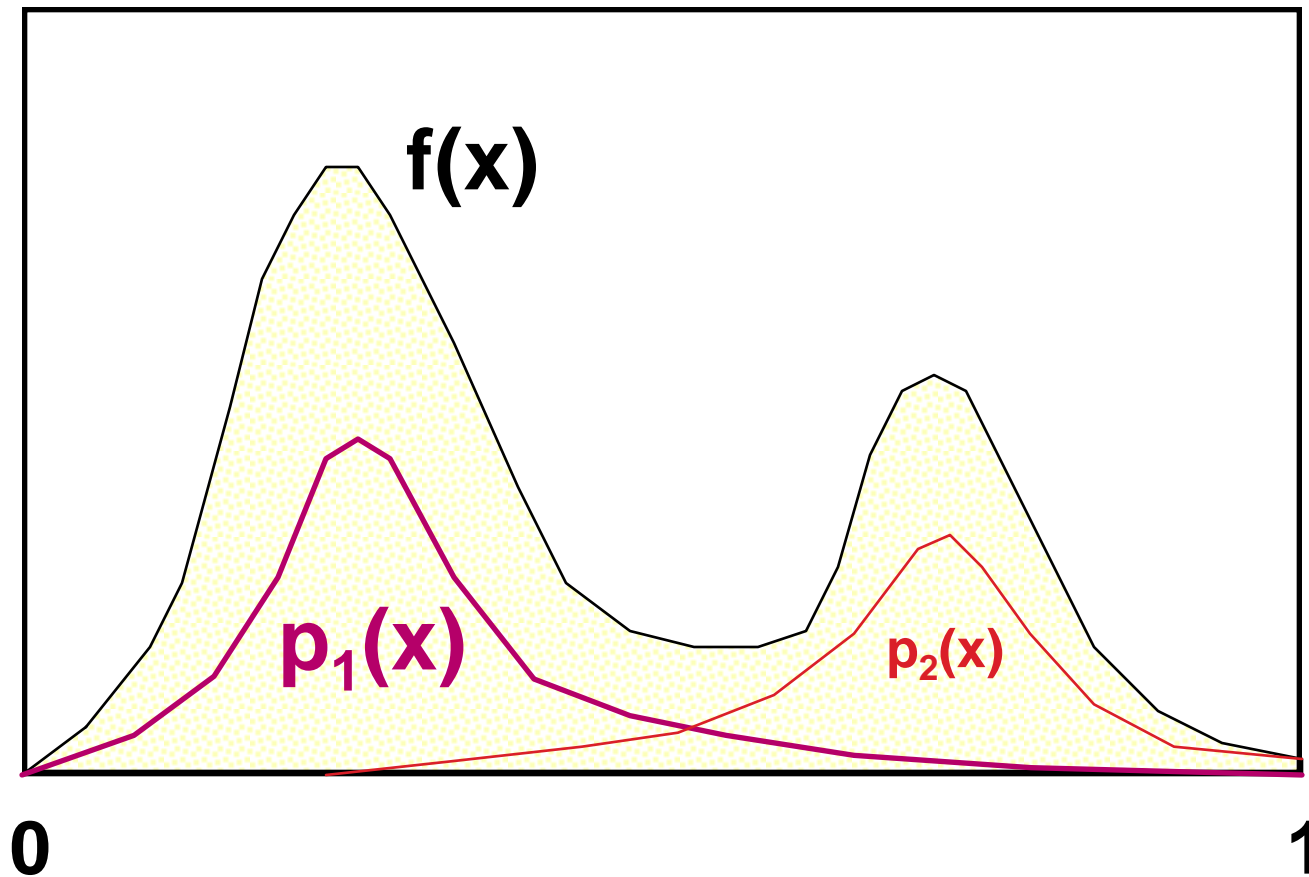
- příspěvek vzorku nezávisí na tom, ze které byl pořízen techniky (tj. pdf)



# Vyrovnaná heuristika (Balance heurist.)

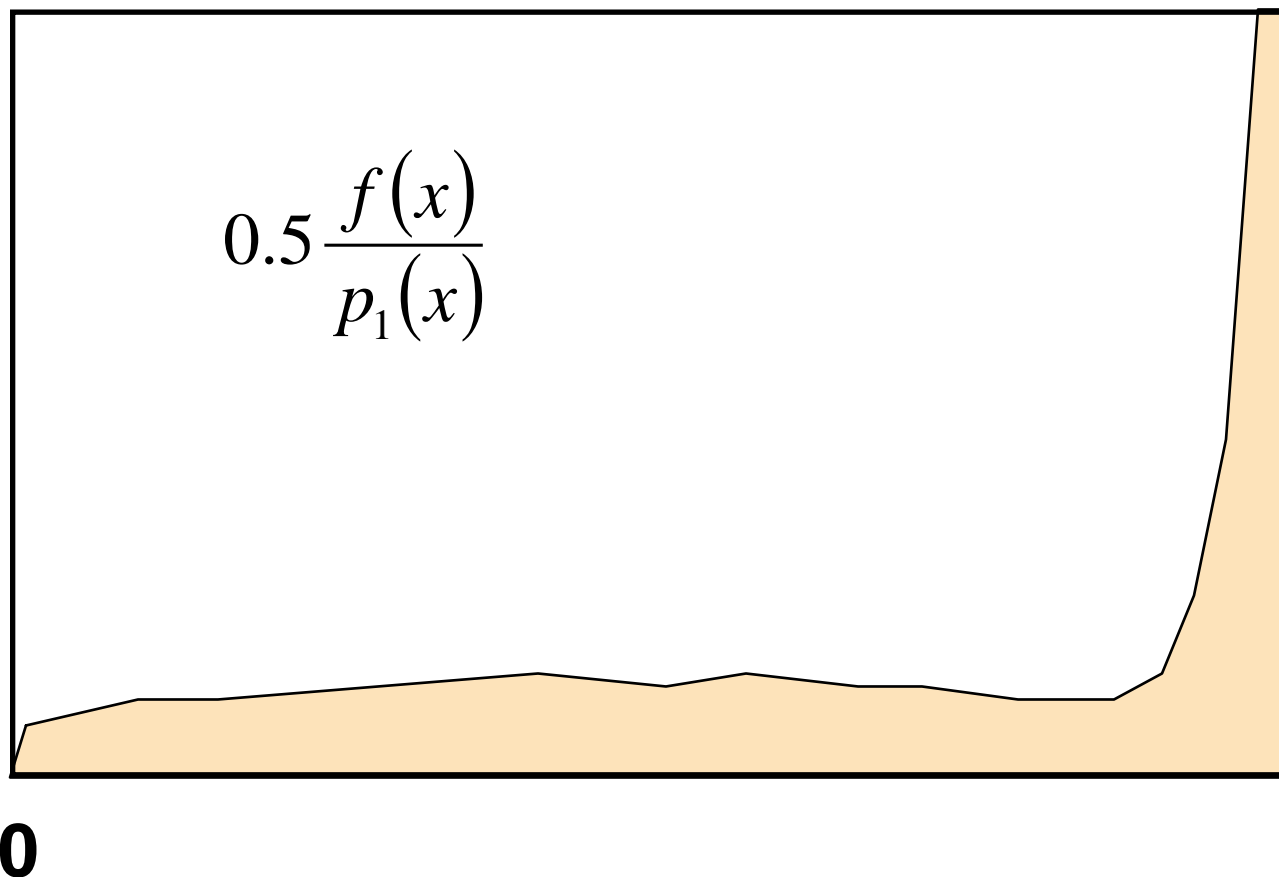
- Vyrovnaná heuristika je téměř optimální
  - Žádný kombinovaný estimátor nemůže mít rozptyl „o mnoho“ menší než vyrovnaná heuristika
- Další možné kombinační heuristiky
  - Maximální heuristika
  - Mocninná heuristika
  - viz. Veach 1997

# Jeden člen kombinovaného odhadu

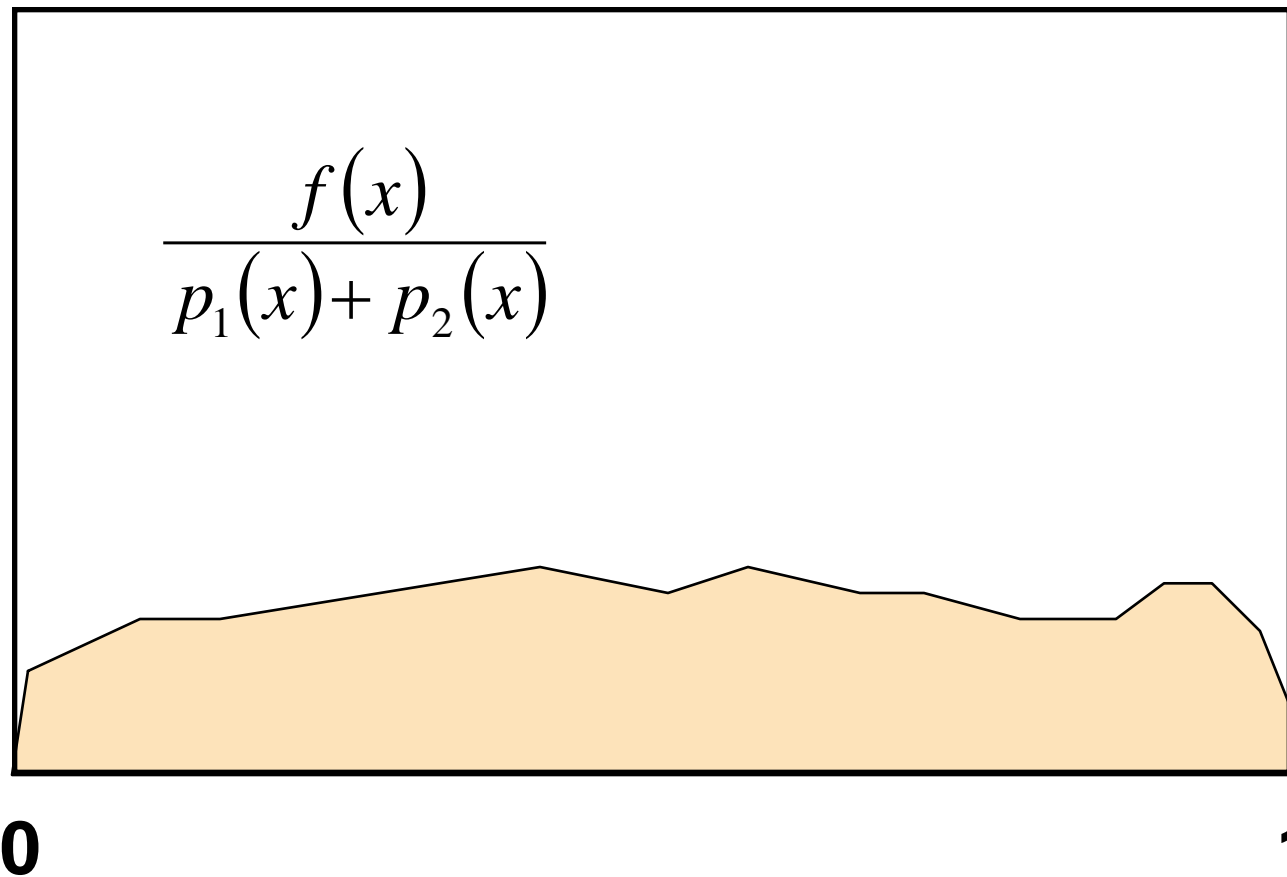


# Aritmetický průměr

$$0.5 \frac{f(x)}{p_1(x)} + 0.5 \frac{f(x)}{p_2(x)}$$



# Vyrovnaná heuristika



---

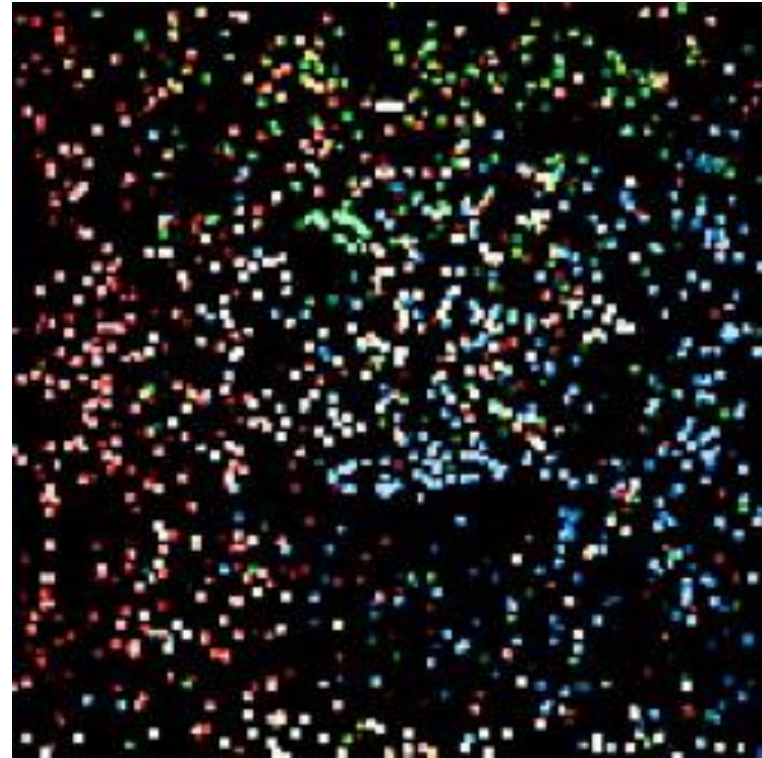
# **Výpočet přímého osvětlení pomocí MIS**

---

# Problém: Najde path tracer světlo?



reference



simple path tracer  
(150 cest na pixel)

Images: Alexander Wilkie

# Přímé osvětlení

- Zapomeňme na chvíli na path tracing
- Řešíme jednodušší problém:

## **přímé osvětlení z daného zdroje světla**

tj. odražená radiance z bodu  $\mathbf{x}$  způsobená osvětlením ze zdroje světla

# Přímé osvětlení: Dva možné přístupy

1. **Vzorkování BRDF**
2. **Vzorkování plochy světel**



# Dvě vzorkovací techniky

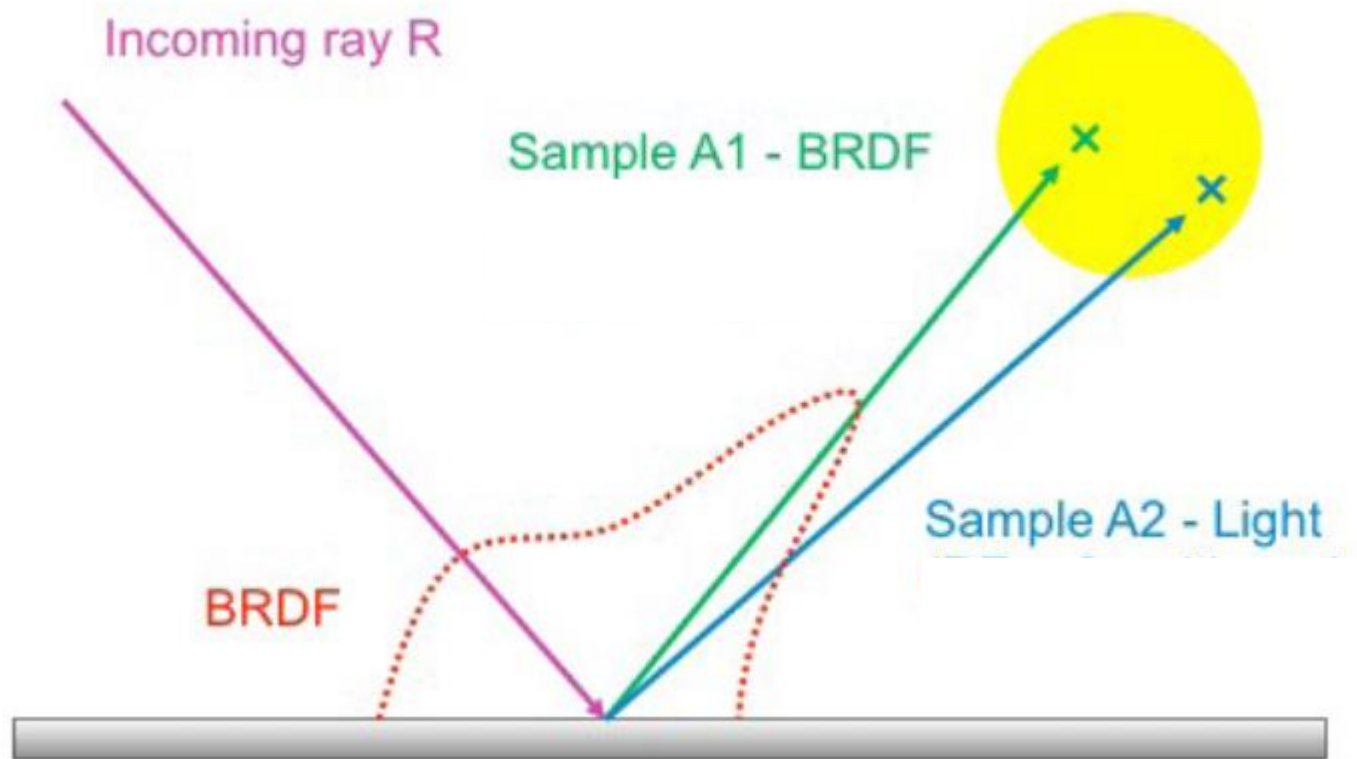


Image: Alexander Wilkie

# Přímé osvětlení: Vzorkování BRDF

- **Formulace integrálu** (integrování přes hemisféru nad  $\mathbf{x}$ )

$$L_r(\mathbf{x}, \omega_o) = \int_{H(\mathbf{x})} L_e(\mathbf{r}(\mathbf{x}, \omega_i), -\omega_i) \cdot f_r(\mathbf{x}, \omega_i \rightarrow \omega_o) \cdot \cos \theta_i \, d\omega_i$$

- **MC estimátor**

- Generujeme náhodný směr  $\omega_{i,k}$  podle hustoty  $p$
- Vrhne paprsek z  $\mathbf{x}$  ve směru  $\omega_{i,k}$
- Pokud protne nějaký zdroj světla, přičteme  $L_e(\cdot) f_r(\cdot) \cos$ /pdf

$$\hat{L}_r(\mathbf{x}, \omega_o) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \frac{L_e(\mathbf{r}(\mathbf{x}, \omega_{i,k}), -\omega_{i,k}) \cdot f_r(\mathbf{x}, \omega_{i,k} \rightarrow \omega_o) \cdot \cos \theta_{i,k}}{p(\omega_{i,k})}$$

# Přímé osvětlení: Vzorkování povrchu zdrojů světla

- **Formulace integrálu** (integrování přes plochu zdroje)

$$L_r(\mathbf{x}, \omega_o) = \int_A L_e(\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{x}) \cdot f_r(\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{x} \rightarrow \omega_o) \cdot V(\mathbf{y} \leftrightarrow \mathbf{x}) \cdot G(\mathbf{y} \leftrightarrow \mathbf{x}) dA_y$$

- **MC estimátor**

- Generujeme náhodnou pozici  $\mathbf{y}_k$  na zdroji
- Testujeme viditelnost mezi  $\mathbf{x}$  a  $\mathbf{y}$
- Pokud  $V(\mathbf{x}, \mathbf{y})=1$ , přičteme  $|A| L_e(\mathbf{y}) f_r(\cdot) \cos/\text{pdf}$

$$\hat{L}_r(\mathbf{x}, \omega_o) = \frac{|A|}{N} \sum_{k=1}^N L_e(\mathbf{y}_k \rightarrow \mathbf{x}) \cdot f_r(\mathbf{y}_k \rightarrow \mathbf{x} \rightarrow \omega_o) \cdot V(\mathbf{y}_k \leftrightarrow \mathbf{x}) \cdot G(\mathbf{y}_k \leftrightarrow \mathbf{x})$$

# Přímé osvětlení: Dva možné přístupy

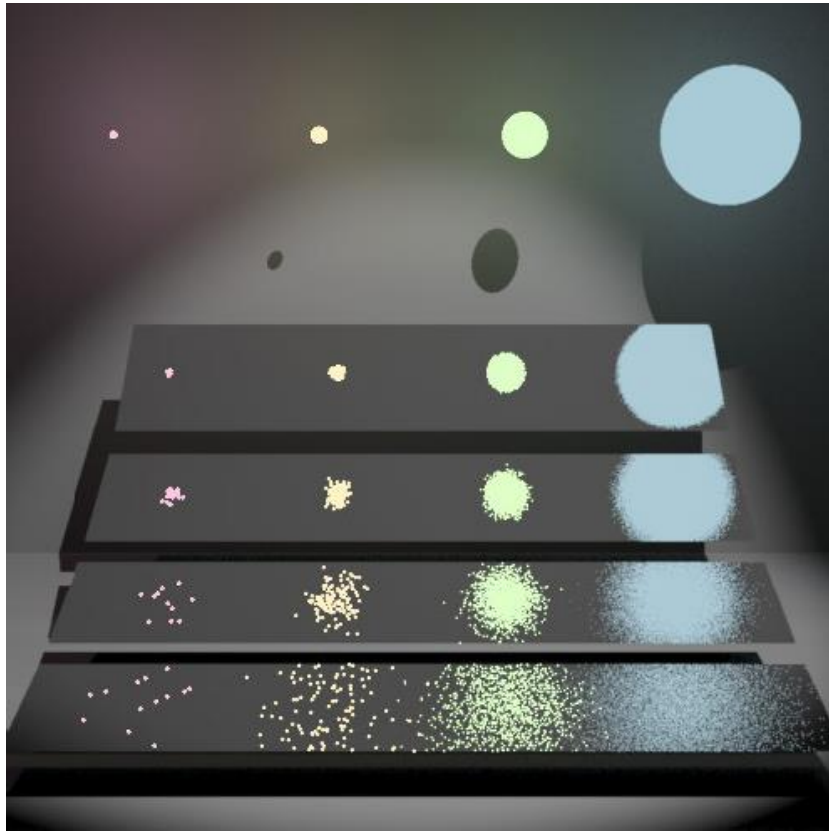
## ■ Vzorkování BRDF

- Výhodnější pro velké zdroje světla
- Pro malé zdroje světla je pravděpodobnost zásahu zdroje velmi malá -> vysoký rozptyl, šum

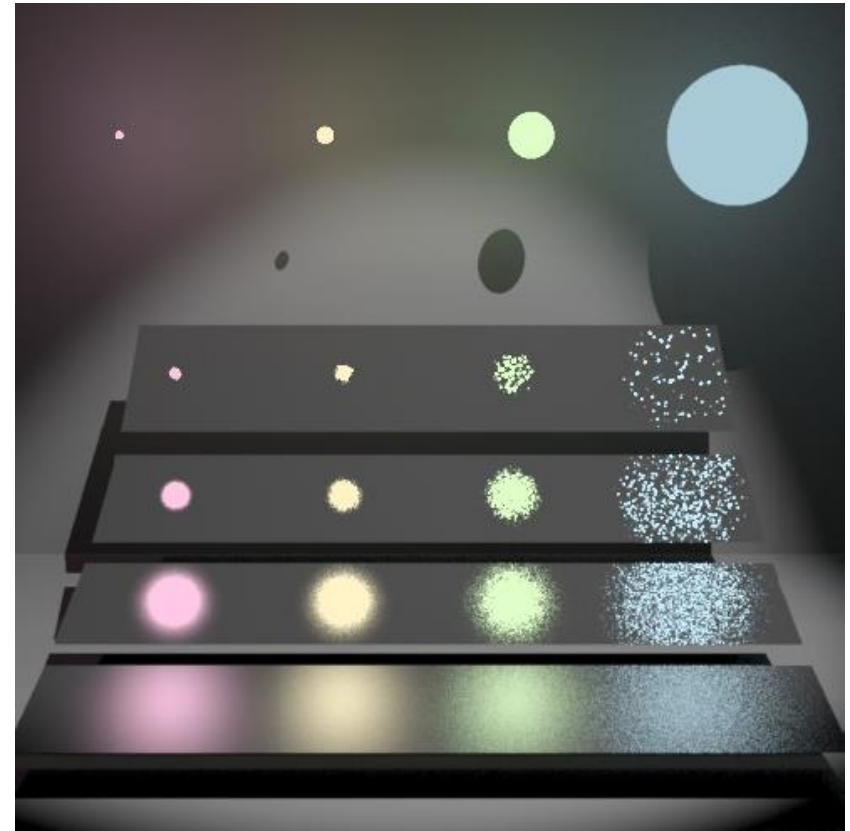
## ■ Vzorkování světel

- Výhodnější pro malé zdroje
- Jediná možná alternativa pro bodové zdroje
- Pro velké zdroje mnoho vzorků mimo lalok BRDF -> vysoký rozptyl, šum

# Přímé osvětlení: Dva možné přístupy



Vzorkování BRDF



Vzorkování světel

Images: Eric Veach

# Přímé osvětlení: Dva možné přístupy

- Kterou techniku zvolit?

- **OBĚ**

- **Problém**

- Obě techniky odhadují stejnou veličinu  $L_r(\mathbf{x}, \omega_o)$

- Pouhým sečtením bychom dostali odhad  $2 L_r(\mathbf{x}, \omega_o)$  - špatně

- Potřebuji vážený průměr příspěvků obou technik

- **Jak zvolit váhy?**

# Jak zvolit váhy?

- **Multiple importance sampling** (Veach & Guibas, 95)
- Váhy závislé na pdf vzorků
- Minimalizuje rozptyl kombinovaného estimátoru
- Téměř optimální řešení

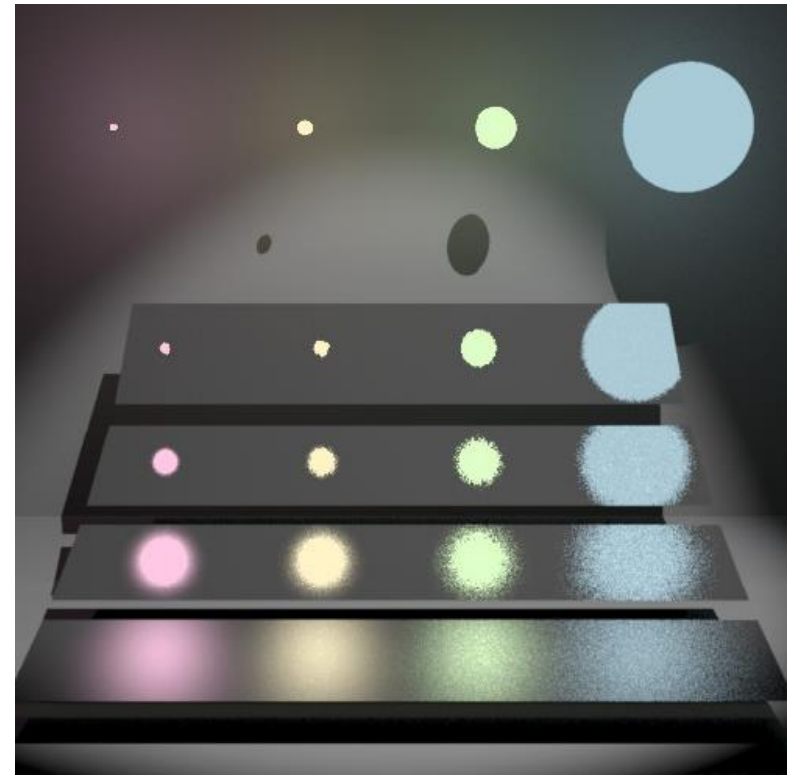


Image: Eric Veach

# Výpočet přímého osvětlení pomocí MIS

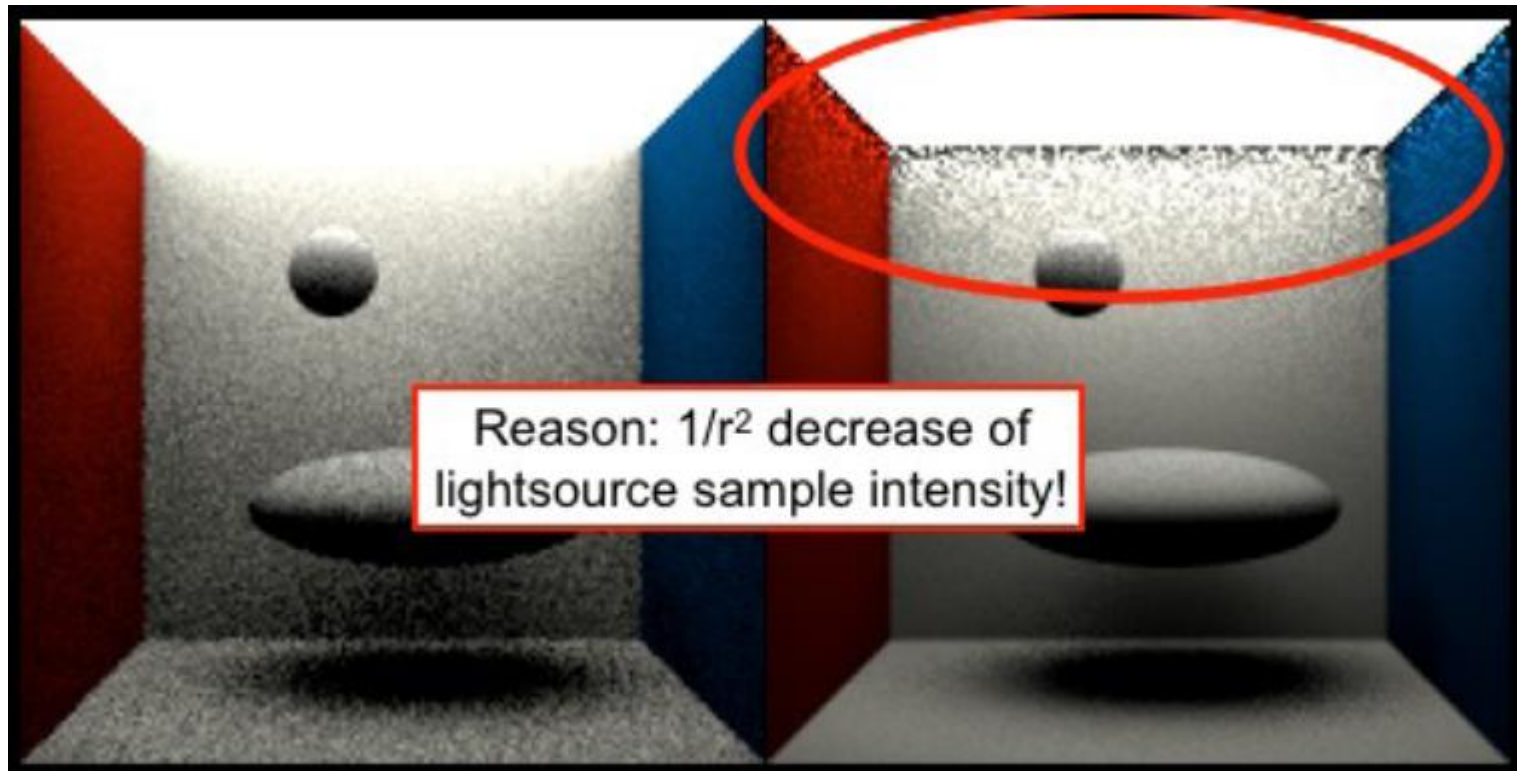


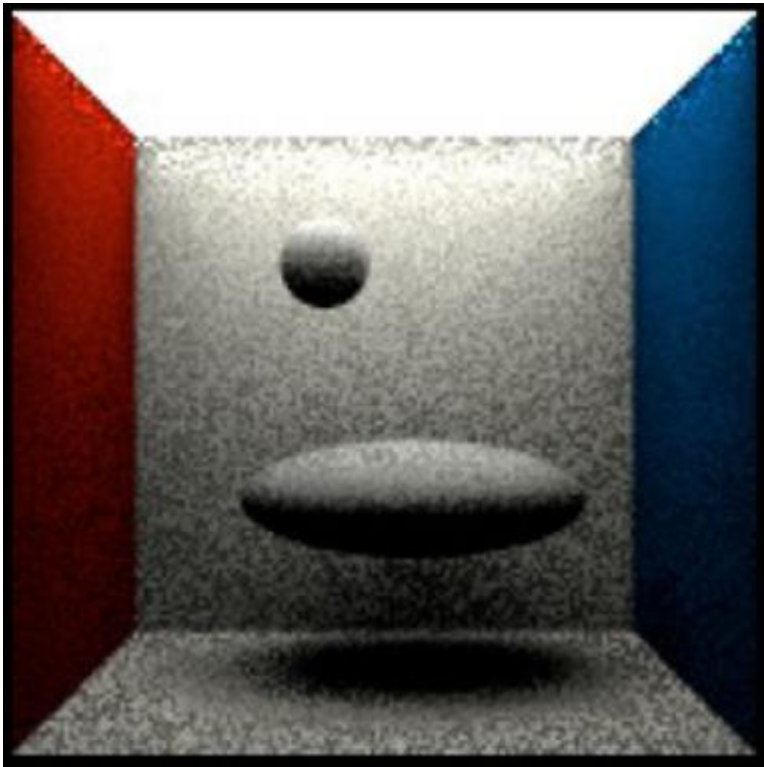
Image: Alexander Wilkie

**Vzorkovací technika (pdf)  $p_1$ :  
Vzorkování BRDF**

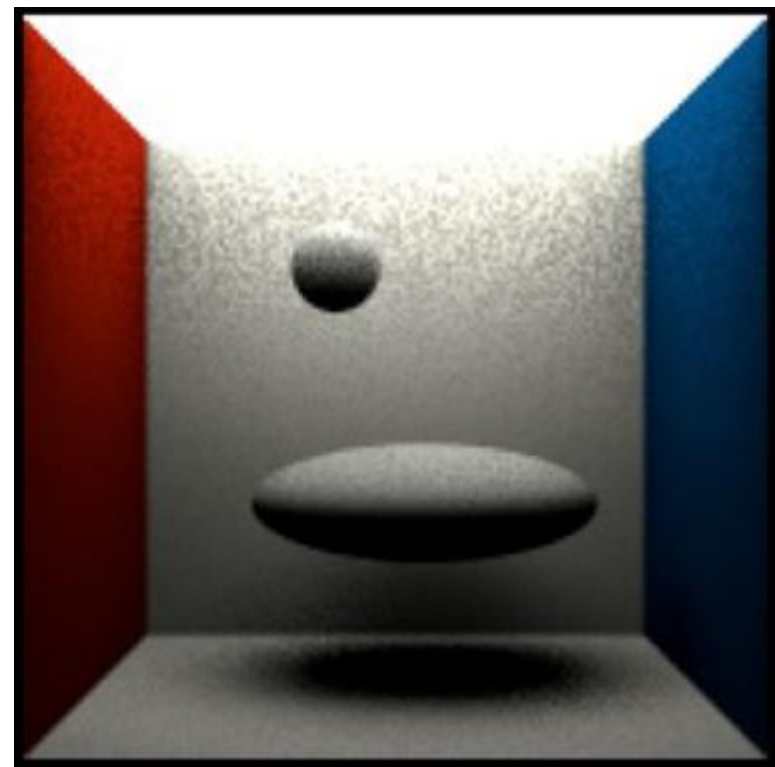
**Vzorkovací technika (pdf)  $p_2$ :  
Vzorkování plochy světla**



# Kombinace



**Aritmetický průměr**  
Zachovává špatné vlastnosti  
obou technik



**Vyrovnaná heuristika**  
Bingo!!!

Image: Alexander Wilkie

# Dvě vzorkovací techniky

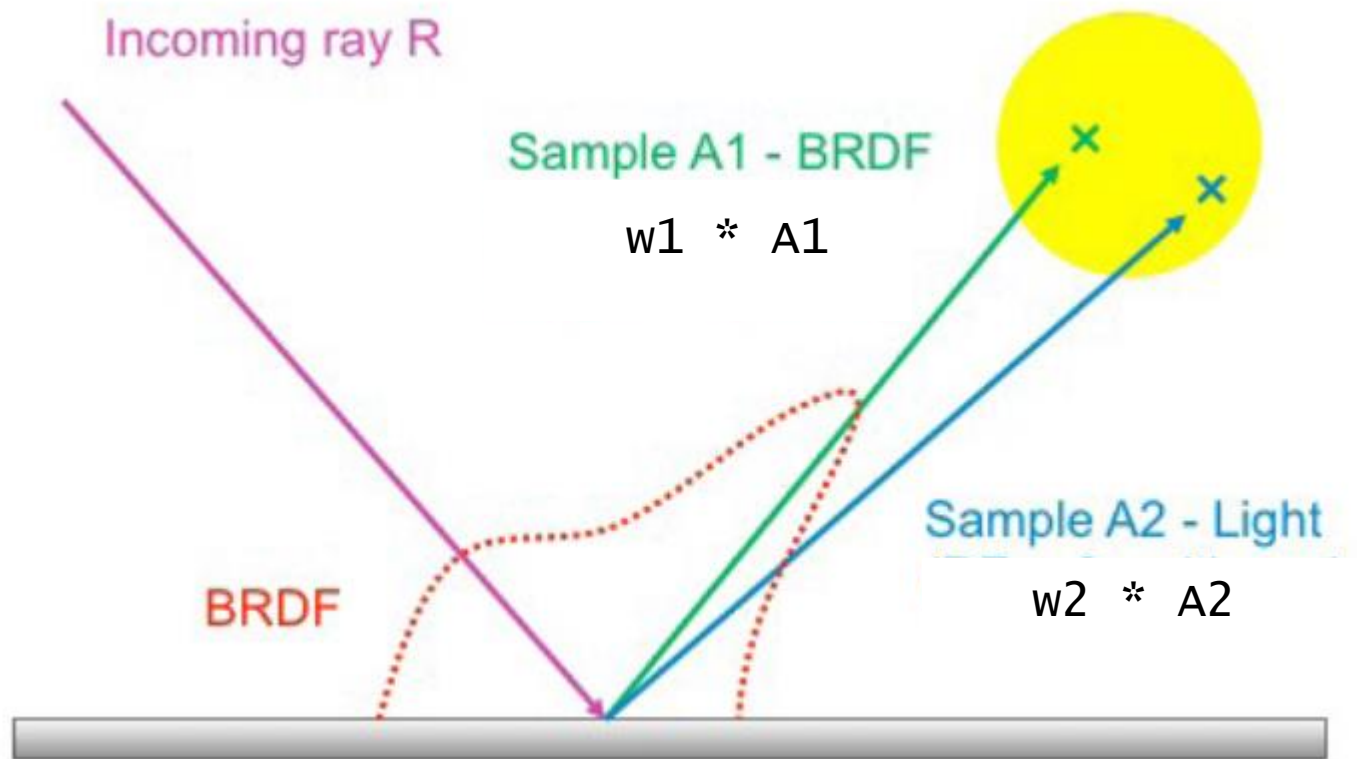


Image: Alexander Wilkie

# Výpočet vah

Váha vzorku z  
BRDF vzorkování

$$w_1(\omega_j) = \frac{p_1(\omega_j)}{p_1(\omega_j) + p_2(\omega_j)}$$

Hustota pravděpodobnosti  
vzorkování z BRDF

**Hustota, s jakou by byl směr  $\omega_j$  vygenerován,  
kdybychom byli použili vzorkování plochy zdroje**

# Hustoty pravděpodobnosti

- **Vzorkování BRDF:  $p_1(\omega)$**

- Závisí na BRDF, např. pro Lambertovskou BRDF

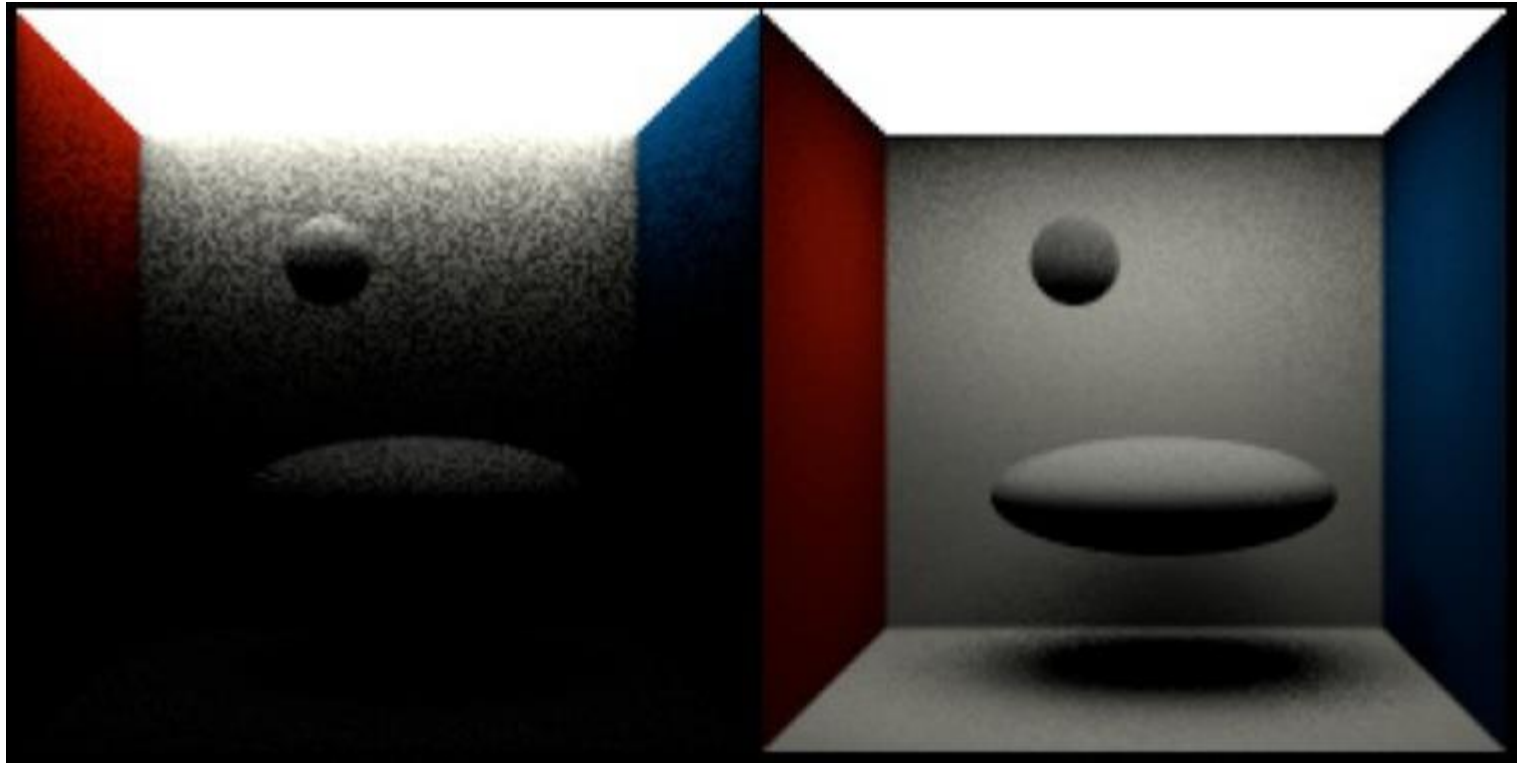
$$p_1(\omega) = \frac{\cos \theta_{\mathbf{x}}}{\pi}$$

- **Vzorkování plochy zdroje:  $p_2(\omega)$**

$$p_2(\omega) = \frac{1}{|A|} \frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2}{\cos \theta_{\mathbf{y}}}$$

↖ **Převodní hustoty  $1/|A|$  z plošné míry (dA) do míry prostorového úhlu (d $\omega$ )**

# Příspěvky vzorkovacích technik



**w1 \* vzorkování BRDF**

**w2 \* vzorkování zdroje**

Image: Alexander Wilkie